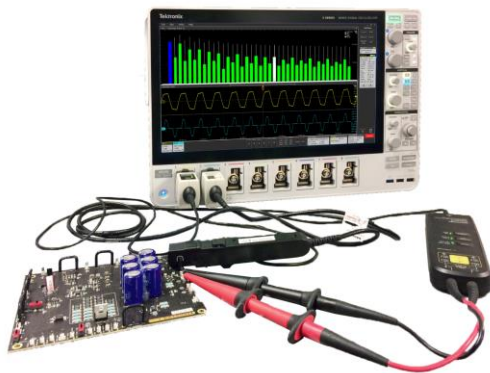


开关损耗测试方案

【测试需求】

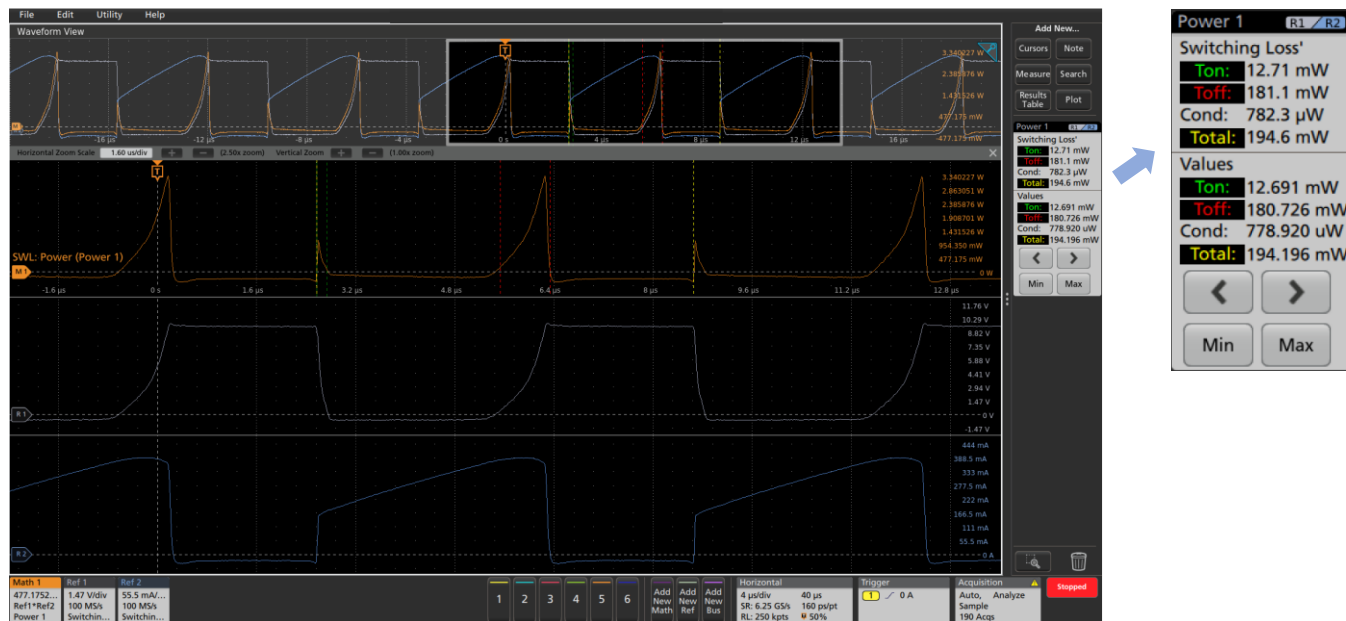
开关电源 (SMPS) 技术依托电源半导体开关器件, 如场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘门双极晶体管 (IGBT)。这些设备提供了快速开关速度, 能够耐受没有规律的电压峰值。同样重要的是, 其在 On 状态或 Off 状态下消耗的功率非常小, 实现了很高的转化效率, 而产生的热量很低。开关设备在极大程度上决定着 SMPS 的整体性能。开关器件的损耗对开关电源来说也是最重要的一个损耗点, 所以开关损耗测试是非常关键的。

【测试平台搭建】



实物连接图

【测试说明】



实测图

【方案配置】

推荐解决方案: MS05+5-PWR+THDP0200+TCP0030A

方案特点: 使用泰克示波器及原厂电源探头, 可补偿探头的延迟, 专用的开关损耗算法, 提供可靠的测试结果。

